

01; 11

**КИНЕТИКА ФОТО-  
И ЭЛЕКТРОННОСТИМУЛИРОВАННОГО ВЫХОДА АТОМОВ  
ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ  
ИЗ-ПОД ОСТРОВКОВ ГРАФИТА НА ИРИДИИ**

*М. В. Кнатько, В. И. Палеев, Н. Д. Потехина*

Приведены результаты экспериментальных исследований кинетики выхода атомов Cs из полостей между придием и двумерными графитовыми островками на его поверхности при облучении поверхности светом и электронами. Рассмотрена модель, которая объясняет особенности диффузии атомов под графитовым покрытием, их выход из-под островков при освещении, а также позволяет определять ряд кинетических параметров этих процессов.

### Введение

Слоистые системы с внедренными в межслойные промежутки атомами и молекулами (интеркалированные системы) находят все большее применение в электронных приборах, в гетерогенном катализе и т. д., поэтому их интенсивно изучают.

В работе [1] сообщено, что облучение электронами или светом монослоя углерода графитовой структуры на иридии с внедренными под этот слой атомами цезия стимулирует выход Cs из-под покрытия. Спектральная зависимость вероятности выхода атомов Cs имеет резонансный характер с максимумом при энергии световых квантов  $\hbar\nu \approx 2.1$  эВ [1]. То же имеет место при внедрении под слой атомов Na и K. Монослойное углеродное покрытие иридия (Ir—C) состоит из набора поднятых над поверхностью металла двумерных островков графита, связанных с подложкой краевыми атомами, «опущенными» на нее [2, 3]. Спектр поглощения графита не имеет особенностей в этой энергетической области [4].

В [1] было заключено, что выход Cs из-под островков при облучении поверхности происходит через «клапаны», открывающиеся при возбуждении межатомных связей углерода с иридием на границе островков светом или электронами. В данной работе исследованы зависимости выхода атомов Cs от времени и от интенсивности освещения. Предложена модель, объясняющая кинетику этих процессов и позволяющая находить их параметры.

### Техника эксперимента и экспериментальные результаты

Опыты проводили в статическом магнитном масс-спектрометре со специальным комбинированным источником ионов [5], предназначенный для изучения процессов на поверхности твердого тела под воздействием светового, электронного и термического возмущений поверхностного слоя. Монослой графита формировали по методике [6] пиролизом паров бензола на нагретой до  $T = -1700$  К иридиевой ленте (ленту помещали в фокусе собирающей линзы масс-спектрометра). Заполнение межслойного пространства цезием осуществляли, как в [7], внедрением щелочных атомов из напыленного на графитовый слой при  $T = 300$  К цезиевого покрытия под островки сквозь дефекты в этом слое. Концентрация внедренных под островки атомов Cs достигала  $\sim 10^{13}$  см<sup>-2</sup>.

Освещение поверхности производили монохроматизированным светом ртутной лампы или лазерами. Для электронного облучения использовали, как в [1], поток фотоэлектронов, получаемых в результате УФ освещения одного из электродов источника.

При температурах ленты  $T > 800$  К все атомы Cs, поступавшие на наружную поверхность графитовых островков, термодесорбировались с них в виде ионов  $Cs^+$ , образующихся путем поверхностной ионизации. Так как время жизни адатомов Cs на внешней поверхности графитового слоя меньше 1 с при  $T > 900$  К [6], то наблюдающиеся медленные, в течение минут, изменения тока ионов  $Cs^+$  нужно связывать лишь с кинетикой поступления атомов Cs на поверхность из-под слоя. Если слой не подвергается облучению, то атомы Cs на наружной поверхности островков появляются лишь вследствие их выхода из-под

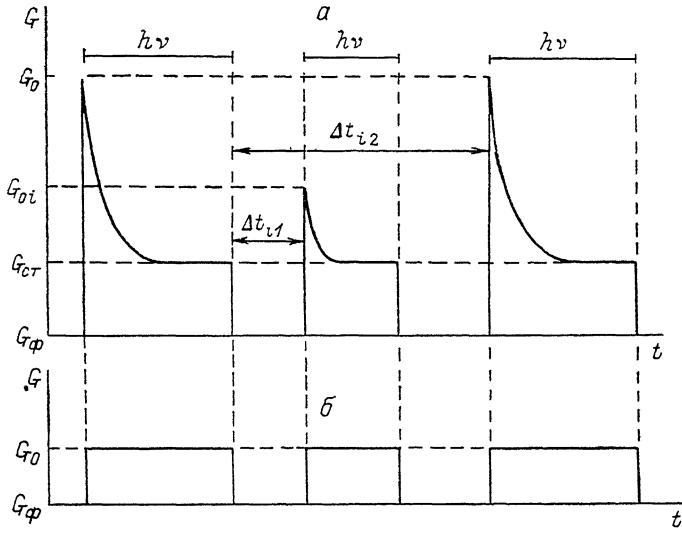


Рис. 1. Зависимость выхода цезия из-под графитовых островков от времени облучения светом или электронами при больших интенсивностях облучения (а) и при малых интенсивностях облучения (б).

островков через структурные дефекты в графитовом монослое (фоновый поток  $G_\phi$ ). В диапазоне температур ленты  $900 < T < 1300$  К, в котором проводились эксперименты,  $G_\phi < 10^6$  см<sup>-2</sup> с<sup>-1</sup> и слабо зависел от  $T$ .

Облучение поверхности светом или электронами вызывало резкий всплеск тока ионов  $Cs^+$ , зависящий от интенсивности облучения. При больших световых или электронных потоках после начального всплеска тока  $G_0$  наблюдается спад тока до некоторой стационарной величины  $G_{ct}$  (рис. 1, а). Прекращение облучения приводит к практически мгновенному уменьшению тока до фонового значения  $G_\phi$ . При очередном цикле облучения высота нового всплеска  $G_0$ , зависит от интервала времени  $\Delta t_i$ , прошедшего между циклами, изменяясь в пределах  $G_0 \geq G_{ci} > G_{ct}$  ( $G_{ci} = G_0$  при  $\Delta t_i > 2$  мин). Лишь после очень большого числа циклов можно заметить небольшое уменьшение  $G_0$ ,  $G_{ct}$  и  $G_\phi$ , связанное с убылью количества заключенного под островками Cs. При малых интенсивностях облучения первоначально полученное значение тока  $G_0$  сохраняется во время экспозиции (рис. 1, б).

На рис. 2 показаны зависимости  $G_0$  от интенсивности освещения  $I$  при различных температурах поверхности. Видно, что с повышением  $T$  насыщение достигается при меньших  $I$ .

При постоянной  $I$  абсолютные величины  $G_0$  уменьшаются с ростом  $T$ ; фотостимулированный выход Cs из-под монослоя графита не заметен при  $T > 1300$  К.

Как и в [1], положим, что в результате освещения иридия, покрытого двумерными графитовыми островками, могут возбуждаться связи краевых атомов углерода с Ir вплоть до их разрыва; это приводит к облегчению выхода Cs из-под островков на открытую поверхность. Хотя время жизни «открытых клапанов» достаточно велико для того, чтобы часть атомов Cs успела выйти из-под островка, оно очень мало в сравнении с периодом освещения ( $t \sim$  мин). Во время освещения «клапаны» хаотически открываются и захлопываются в разных местах вдоль границы (периметра) островка, а вышедшие из-под островков частицы десорбируются, не накапливаясь вблизи этой границы.

Характер спада ионного тока со временем (рис. 1, a) показывает, что количество атомов Cs, находящихся вблизи границы и способных выйти из-под островков, постепенно истощается при непрерывном освещении и уменьшается до некоторой квазистационарной величины при заданной интенсивности освещения. Это свидетельствует о достижении равенства между потоками атомов Cs, выходящими из-под островка и поступающими в приграничную область островка из его центральной части. С другой стороны, тот факт, что величина максимального всплеска  $G_0$  восстанавливается (при достаточно больших  $\Delta t$ ), показывает, что общая концентрация цезия под островками практически не меняется в ходе эксперимента. Действительно, по нашим оценкам,  $G \approx 10^7 - 10^8 \text{ см}^{-2} \text{ с}^{-1}$  и поэтому мало сказывается на концентрации  $N_0$  частиц под графитовым слоем, достигающей  $N_0 \approx 10^{12} - 10^{14} \text{ см}^{-2}$  [2]. Из результатов опытов, таким образом, следует, что лимитирующими

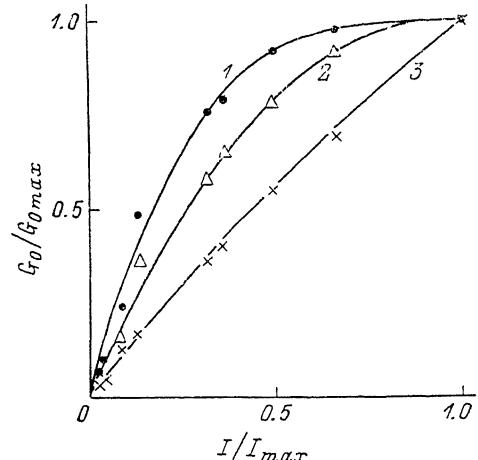


Рис. 2. Зависимость  $G_0$  от интенсивности светового облучения.

$t, \text{ К: } 1 - 1080, 2 - 990, 3 - 900.$

ющим процессом, определяющим величину  $G_{ct}$  и время восстановления начального пика  $G_0$ , является диффузия атомов под островками к их границам.

Сформулируем математическую задачу для определения зависимостей  $G(t)$  и  $G(t)$  через кинетические параметры, характеризующие отклик графитового слоя на освещение и движение атомов Cs под островком.

Будем считать, что единица поверхности монослойного графитового покрытия иридия состоит из  $m$  одинаковых островков — дисков радиуса  $R$ . Суммарный периметр этих островков составляет  $Q = 2\pi Rm$ , а общее число связей C—Ir на границе островков  $p = Q/\Delta l$ , где  $\Delta l$  — расстояние между соседними связями. Предположим, что число возбуждаемых за 1 с на  $1 \text{ см}^2$  связей пропорционально интенсивности освещения  $I$ , сечению возбуждения  $\sigma$  и числу невозбужденных связей. Введем время жизни возбужденной связи  $\tau$ . Тогда изменение числа открытых клапанов  $K$  со временем  $t$  при включении освещения определяется уравнением

$$\frac{dK}{dt} = \sigma I (p - K) - \frac{K}{\tau}, \quad (1)$$

решение которого имеет вид

$$K(t) = K_{ct} [1 - \exp(-\alpha t)], \quad (2)$$

где  $K_{ct} = \sigma I p / \alpha$ ,  $\alpha = \sigma I + \tau^{-1}$ .

Резкие, почти вертикальные подъем и спад тока при включении и выключении света (рис. 1) показывают, что  $\alpha^{-1}$  — характерное время достижения величины  $K_{ct}$  очень мало, и поэтому в дальнейшем можно считать величину  $K \approx K_{ct}(I)$  не зависящей от времени.

Введем  $\times$  долю открытой для выхода частиц из-под островков части периметра

$$\times = K_{ct}/p = \sigma I / (\sigma I + \tau^{-1}) \quad (3)$$

и определим удельный поток частиц через 1 см периметра островков

$$g(t) = \times v_1 n(t), \quad (4)$$

где  $v_1(T) = \omega_1(T) a_1$  — скорость выхода частиц через границу островка;  $\omega_1(T)$ ,  $a_1$  — соответственно частота и длина миграционного скачка через границу;  $n(t)$  — концентрация частиц под островком у его границы.

Поток десорбирующихся с поверхности ионов  $Cs^+$  при  $T > 800$  К равен потоку всех вышедших из-под островков частиц, и с  $1\text{ cm}^2$  поверхности, следовательно, десорбируется поток  $G(t)$  ионов

$$G(t) = 2\pi R m g(t) = 2\pi R m \times v_1 n(t). \quad (5)$$

Таким образом, зависимость  $G(t)$  определяется зависимостью  $n(t)$ .

Пусть в начальный момент освещения  $t=0$  реализуется некоторое распределение  $n(r)$  частиц под островком, причем вблизи границы  $n|_{r=R} = n_0$ . Включение света приводит к всплеску удельного потока  $g_0 = \times v_1 n_0$ , за которым следует уменьшение тока  $Cs^+$  со временем, если выход частиц через клапаны не уравновешивается их подходом к границе островка. Изменение концентрации частиц в слое некоторой толщины  $\lambda$  вблизи периметра островка ( $R-\lambda \leq r \leq R$ ) подчиняется уравнению баланса

$$\lambda \frac{d\bar{n}}{dt} = -\times v_1 n|_{r=R} - D \frac{\partial n}{\partial r} \Big|_{r=R-\lambda}, \quad (6)$$

где  $\bar{n}$  — средняя концентрация в слое  $\lambda$ .

Равенство (6) при  $\lambda \rightarrow 0$  может служить граничным условием при решении диффузационного уравнения для  $n(r, t)$ . Однако в нашем случае, когда  $n=N_0=\text{const}$  при  $r < R-\lambda$ , все изменение  $n(r, t)$  происходит только в примыкающем к границе островка слое  $\lambda$ ; достигаемое за время освещения постоянство тока  $G$ , означает, что поток вышедших из-под островков частиц уравновешен их поступлением к периметру островков. При  $G(t) \approx G_{ct}$ , таким образом, выполняется равенство

$$G_{ct} = \times v_1 n|_{r=R} \approx -D \frac{\partial n}{\partial r} \Big|_{r=R-\lambda} = \text{const}, \quad (7)$$

и, следовательно, ширина слоя  $\lambda$ , определяющая градиент концентрации в нем атомов  $Cs$ , остается за время наблюдения приблизительно постоянной. Поэтому вместо нахождения  $n(r, t)$  из диффузационного уравнения с условием (6) мы ограничимся определением зависимости  $n(t)$  в приграничном слое постоянной ширины  $\lambda$ , предполагая, что за пределами этого слоя концентрация не изменяется. Аппроксимируем истинное распределение частиц под островком при освещении ступенчатым

$$n(r, t) = \begin{cases} N_0, & r < R - \lambda, \\ n(t), & R - \lambda \leq r \leq R, \end{cases} \quad (8)$$

как показано на рис. 3. При этом  $\bar{n} = n(t)$ , и уравнение (6) переходит в кинетическое уравнение для определения  $n(t)$

$$\lambda \frac{dn}{dt} = -\times v_1 n + v N_0 - v_0 n, \quad n|_{t=0} = n_0. \quad (9)$$

В (9) введены разные скорости для диффузии атомов из центральной части островка в приграничную область  $v$  и для движения в обратном направлении  $v_0$ . Можно показать, что решение уравнения (9) при условии, что  $v=v_0$  и не зависит от концентрации частиц, противоречит полученным нами экспериментальным результатам, поэтому предполагаем, что скорость диффузии частиц зависит от их концентрации. Такое предположение согласуется с данными работ [8, 9].

в которых заключено, что коэффициент диффузии интеркалянтов увеличивается в процессе интеркалирования. Это связано, вероятно, с увеличением зазора между соседними графитовыми слоями при увеличении концентрации интеркалянта. Расстояние между монослойным графитовым покрытием и иридиевой подложкой также может зависеть от  $n$ , поскольку островки деформируются даже под действием очень слабых сил [1]. Границные атомы углерода в островках, однако, прочно связаны с подложкой и, по-видимому, мало подвижны. Поэтому проникновение Cs в обедненный приграничный слой происходит с меньшей скоростью, чем движение частиц в обратном направлении, в область с постоянной концентрацией  $N_0$ , т. е.  $v = v(n) < v_0$ . Будем считать в первом приближении, что скорость поступления Cs в приграничную область линейно зависит от концентрации в ней атомов Cs и изменяется от минимальной  $v_{\min} (n \rightarrow 0)$  до максимальной  $v_{\max} = v_0 n_0 / N_0$ .

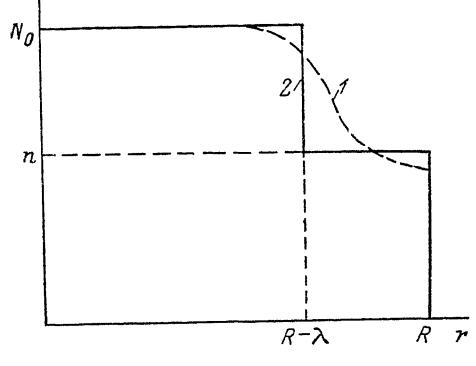


Рис. 3. Схема распределения концентрации Cs в приграничной области под графитовым островком при облучении поверхности.

1 — истинное распределение, 2 — принятное.

$$g(t) = \frac{xv_1 n_0}{1 + \frac{xv_1}{v^*}} \left[ 1 + \frac{xv_1}{v^*} \exp \left( -\frac{xv_1 + v^*}{\lambda} t \right) \right],$$

$$g|_{t=0} = g_0 = xv_1 n_0, \quad g|_{t \rightarrow \infty} = g_{ct} = \frac{g_0}{1 + xv_1/v^*}. \quad (12)$$

Эти выражения позволяют связать экспериментально определяемые и выражаемые по (5) потоки десорбции  $G(t)$ ,  $G_0$ ,  $G_{ct}$  с кинетическими параметрами  $x$ ,  $v_1$ ,  $v^*$  рассматриваемого процесса

$$\ln \frac{G(t) - G_{ct}}{G_{ct}} = \ln \frac{xv_1}{v^*} - \frac{xv_1 + v^*}{\lambda} t, \quad (13)$$

$$\frac{G_0 - G_{ct}}{G_{ct}} = \frac{xv_1}{v^*}, \quad (14)$$

$$-\frac{dG(t)}{G_0 dt} \Big|_{t=0} = \frac{xv_1}{\lambda}, \quad (15)$$

$$-\frac{dG(t)}{G_0^2 dt} \Big|_{t=0} = \frac{1}{n_0 \lambda}. \quad (16)$$

Отношение  $v^*/\lambda$  можно определить как из (14), (15), так и непосредственно по зависимости  $G_{0i}(\Delta t_i)$ . Действительно, при выключенном освещении изменение концентрации  $n(t)$  в приграничной области следует в нашей модели уравнению  $\lambda(dn/dt) = v^*(n_0 - n)$ . Подставив решение этого уравнения с начальным условием  $n|_{t=0} = n_{ct} = n_0/(1 + xv_1/v^*)$  в формулу (5), получим зависимость  $G_{0i}(\Delta t_i)$

$$G_{0i} = G_0 \left[ 1 - \frac{xv_1}{v^* + xv_1} \exp \left( -\frac{v^*}{\lambda} \Delta t_i \right) \right] \quad (17)$$

или

$$-\ln \frac{G_0 - G_{0i}}{G_0} = \ln \left( 1 + \frac{v^*}{\nu v_1} \right) + \frac{v^*}{\lambda} \Delta t_i, \quad (18)$$

откуда можно определить  $v^*/\lambda$ .

Пользуясь (3) и (12), получаем из (5) зависимость потоков десорбирующихся частиц от интенсивности освещения  $I$

$$G_0(I) = 2\pi R m n_0 v_1 \frac{\sigma I \tau}{1 + \sigma I \tau}, \quad (19)$$

$$G_{ct}(I) = G_0(I) \left[ 1 + \frac{v_1}{v^*} \frac{\sigma I \tau}{1 + \sigma I \tau} \right]. \quad (20)$$

В предельных случаях больших и малых интенсивностей света, учитывая, что  $\propto|_{I \rightarrow \infty} \rightarrow 1$ ,  $\propto|_{I \rightarrow 0} = \sigma I \tau \rightarrow 0$ , находим

$$\frac{G_{ct}}{G_0} \rightarrow \begin{cases} v^*/v_1, & \text{при } I \rightarrow \infty, \\ 1, & \text{при } I \rightarrow 0, \end{cases} \quad (21)$$

Таким образом,  $G_0 = G_{ct}$  при малых  $I$ , т. е. первоначально полученный фотостимулированный поток частиц из-под слоя сохраняется неизменным во времени (рис. 1, б). Можно показать, что всплеску  $G_0 > G_{ct}$  отвечает неравенство  $\sigma I \tau > \xi v^*/v_1$ , где  $\xi$  — предельная чувствительность измерений тока. Как следует из (19), при малых световых потоках зависимость  $G_0(I)$  должна быть линейной, т. е.  $G_0(I)/G_0(\infty) = \sigma I$ . Это также подтверждается экспериментальными результатами, приведенными на рис. 2, 4. Если абсолютные величины  $I$  известны, то по наклону зависимости  $G_0(I)$  можно найти  $\sigma \tau$ .

В пользу правильности рассмотренной модели свидетельствует также совпадение величины  $v^*/\lambda$  при  $T = \text{const}$  как при получении ее по (14), (15), так и по зависимости (18) для  $G_{0i}(\Delta t_i)$ .

С помощью рассмотренной модели диффузии можно сделать некоторые заключения о свойствах исследуемой интеркалированной системы. Так, измерения  $G(t)$  при облучении поверхности световыми потоками разной интенсивности показали, что величина  $1/n_0 \lambda$ , полученная из (16), не зависит от  $I$  и остается практически неизменной при изменении температуры системы в диапазоне  $800 < T < 1300$  К, а величина  $v^*/\lambda$  возрастает с повышением  $T$ . Из расчетов следует линейная зависимость  $\ln(v^*/\lambda) = f(1/T)$ , что характеризует активированный процесс диффузии. Так как  $v^* = N_0/n_0 v_{min}$ , а  $(n_0 \lambda)$  и  $N_0$  не зависят от  $T$ , то из температурной зависимости  $v^*/\lambda = A \exp(-E/kT)$  можно найти энергию активации диффузии Cs в приграничную область островка и предэкспоненту этого процесса; их величины оказались равными  $E = 0.2 \pm 0.1$  эВ и  $A = (5-10) \text{ с}^{-1}$ . Сравнение этих величин с характеризующими миграцию атомов Cs по открытой поверхности графитовых островков [10] показывает, что энергия активации в обоих случаях близки, в то время как полученная нами предэкспонента в много порядков величин меньше, чем в случае скачкообразного перемещения одиночных атомов Cs по поверхности графита или иридия. Малая величина предэкспоненты при движении Cs под островками указывает на малую вероятность проникновения атомов Cs в приграничную зону.

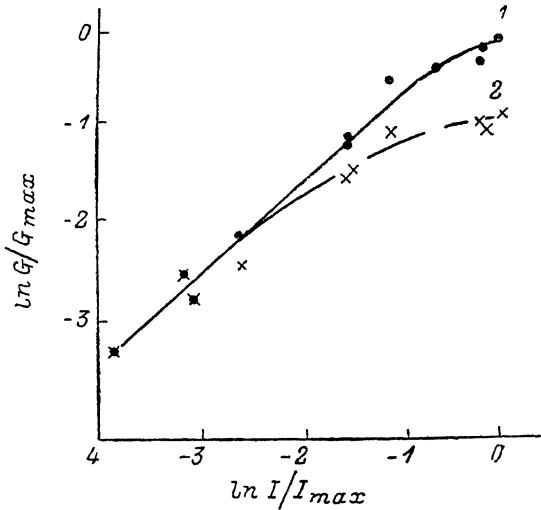


Рис. 4. Зависимости  $G_0(I)$  (1) и  $G_{ct}(I)$  (2) при световом облучении при  $T=1000$  К.

Возможно, что в результате истощения концентрации Cs под островками у их границ зазор между графитовым слоем и металлом в приграничной области уменьшается, так что проникновение в нее отдельных атомов Cs становится невозможным до тех пор, пока у границы истощенной области не образуется из атомов Cs зародыш квазиметаллической структуры, вызывающий приподнимание слоя графита и проникновение Cs в расширенный зазор. Тогда вероятность (и скорость) заполнения этой области будет определяться вероятностью образования такого зародыша и зависеть от концентрации Cs, и предэкспонента температурной зависимости  $v^*(T)/\lambda$  окажется существенно меньшей, чем в случае миграционных скачков отдельных атомов. Эти соображения косвенно подтверждаются данными по кинетике интеркалирования графита [11, 12], которые интерпретированы авторами этих работ в предположении, что внедрение чужеродных частиц между слоями графита происходит путем образования зародышей кристаллической фазы из этих частиц у краев графитовых слоев.

В заключение отметим, что рассмотренная выше кинетика выхода атомов из под островков графита на иридии не зависит от вида облучения, вызывающего возбуждение связи C—Ir. От него существенно зависит только сечение возбуждения  $\sigma$ : например, при облучении электронами  $\sigma$  на 6–7 порядков больше, чем для фотонов, и слабо зависит от энергии электронов [1]. Различия в величинах  $\sigma$  вызываются, вероятно, спецификой механизма передачи энергии возбуждения на разрываемую на границе островка связь в каждом случае.

Авторы благодарят Э. Я. Зандберг за интерес к работе и обсуждение ее результатов.

### Литература

- [1] Зандберг Э. Я., Кнатъко М. В., Палеев В. И. // Письма в ЖТФ. 1986. Т. 12. Вып. 7. С. 388–392.
- [2] Рутъков Е. В., Тоннегоде А. Я. // ЖТФ. 1982. Т. 52. Вып. 5. С. 921–927.
- [3] Потехина Н. Д. // Поверхность. 1987. № 4. С. 14–24.
- [4] Greenaway D. L., Harbeck G., Bassani F., Tosatti E. // Phys. Rev. 1969. Vol. 178. N 3. P. 1340–1348.
- [5] Кнатъко М. В. // Тез. докл. IV Всес. конф. по масс-спектрометрии. Сумы, 1986. Ч. 2. С. 25–26.
- [6] Зандберг Э. Я., Рутъков Е. В., Тоннегоде А. Я. // ЖТФ. 1975. Т. 45. Вып. 9. С. 1884–1891.
- [7] Галль Н. Р., Михайлов С. Н., Рутъков Е. В., Тоннегоде А. Я. // ФТТ. 1985. Т. 27. Вып. 8. С. 2351–2356.
- [8] Barker J. A., Croft R. C. // Aust. J. Chem. 1953. Vol. 6. P. 302.
- [9] Dziedianowicz T., Leong K., Forsman W. C. // Mat. Res. Soc. Symp. Proc. 1983. Vol. 20. P. 277–282.
- [10] Зандберг Э. Я., Потехина Н. Д., Рутъков Е. В., Тоннегоде А. Я. // ЖТФ. 1982. Т. 52. Вып. 12. С. 2398–2404.
- [11] Zabel H., Magerl A., Rush J. J., Dianoux A. J. // Mat. Res. Soc. Symp. Proc. 1983. Vol. 20. P. 289–291.
- [12] Dresselhaus M. S., Dresselhaus G. // Advances in Phys. 1981. Vol. 30. N 2. P. 139–326.

Физико-технический институт  
им. А. Ф. Иоффе АН СССР  
Ленинград

Поступило в Редакцию  
3 декабря 1987 г.